

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0205U002772

Державний реєстраційний номер: 0103U002142

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-05-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка макетного зразка скануючого мікрохвильового мікроскопа

Початок етапу: 09.2003

Закінчення етапу: 12.2004

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Харківський національний університет радіоелектроніки

Код за ЄДРПОУ: 02071197

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 057-7021-397

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування

Код за ЄДРПОУ: 14310589

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): АТ "Інститут інформаційних технологій"

Код за ЄДРПОУ: 22723472

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 00026777

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка високоефективного методу та технічних засобів ближньопольової скануючої мікрохвильової мікроскопії для наноелектроніки.

Назва роботи англійською:

Development of high-performance method and technology of near-field scanning microwave microscopy for nanoelectronics.

Реферат українською:

Розроблені нові методи та технічні засоби мікрохвильової мікроскопії для локальної безелектродної мікродіагностики фундаментальних властивостей матеріалів (мікрорельєфу, імпедансу, діелектричної проникності, часу життя та рухливості носіїв заряду та ін.), направлені на підвищення їх роздільної здатності і метрологічної ефективності. Створено макетний зразок мікрохвильового мікроскопа.

Реферат англійською:

New methods and means of microwave microscopy for local non-destructive micro-diagnostics of the fundamental material properties (a microrelief, an impedance, surface resistance, dielectric permeability, lifetime and mobility of charge carriers, etc.), directed on their resolution and metrological efficiency increase are developed. The model sample of a microwave microscope is created.

Індекс УДК: 621.315.592, 621.315.592

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Сліпченко Микола Іванович

Науковий ступінь:

Наукове звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Сліпченко Микола Іванович

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

